

平成 27 年 7 月 7 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 田島 道夫

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 144 回研究会 開催通知

日時： 2015 年 8 月 21 日 (金) 13:00 ~ 17:30
会場： 明治大学 駿河台キャンパス グローバルフロント 1 階 多目的室
http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html
東京都千代田区神田駿河台 1-1 (TEL 03-3296-4545)
JR 中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩 3 分
東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩 5 分
都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩 5 分

テーマ 「X 線・電子線による計測技術の新展開
-静的構造評価を極め、動的評価、電子状態計測に挑む-

世話人：志村考功 (大阪大学)、廣沢一郎 (高輝度光科学研究センター)、表 和彦 (リガク)

プログラム

13:00~13:05	開会の挨拶	明治大学 田島道夫
13:05~13:10	はじめに	大阪大学 志村考功
13:10~13:50	「曲がる X 線をとらえる高感度 X 線撮影」	東北大学 百生 敦
13:50~14:30	「放射光 X 線を用いたフェムト~ピコ秒オーダーの分子構造解析」	物質構造科学研究所 足立伸一
14:30~15:10	「電子回折イメージングの展開」	北海道大学 郷原一寿
15:10~15:25	休憩	
15:25~16:05	「すれすれ入射 2 次元 X 線回折法による有機半導体薄膜成長過程のその場観察」	岩手大学 吉本則之
16:05~16:45	「単結晶 FeNi 規則合金薄膜における X 線構造解析」	東北大学 水口将輝
16:45~17:25	「放射光 HAXPES 法を用いた GaN-HEMT のバンド構造解析技術開発」	富士通研究所 野村健二
17:25~17:30	おわりに	高輝度光科学研究センター 廣沢一郎
17:40~19:40	意見交換会(明治大学駿河台キャンパス リバティータワー23 階宮城浩蔵ホール)	以上